

北京蔡司X射线断层扫描授权代理商

产品名称	北京蔡司X射线断层扫描授权代理商
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	3000000.00/件
规格参数	产地:德国 品牌:蔡司 型号:METROTOM
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

产品详情

工业CT是工业用计算机断层成像技术的简称，它能在对检测物体无损伤的条件下，以二维断层图像或三维立体图像的形式，清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况，被誉为当今*佳无损检测和无损评估技术。

随着工业产品越来越在追求高质量的同时加快新产品上市的周期，对于检测手段及方式有着更高的挑战。在这篇文章中，我们将介绍如何利用工业CT完成某款产品的全尺寸测量，以及如何借助北京蔡司X射线断层扫描授权代理商首丰联合测量设备有限公司的产品实现这一目标。

以该产品为例，要求完成总计700多个尺寸检测，其中FAI尺寸将近300余个。根据传统的使用三坐标测量机的方式，编程时间通常需要将近两周，而单件产品的测量需要半天的时间。然而，通过工业CT扫描生成体积文件，并使用FAI尺寸编程以及与非FAI尺寸数模比对的两种分析方式，编程时间可以缩短一半，而单件检测时间则减少至10分钟。这极大地提高了产品检测效率，从而加速了新产品上市的速度。与传统的三坐标机测量方式相比，工业CT的误差在可接受的范围内，证明了其方式的稳定性和可靠性。

在此过程中，蔡司工业测量技术部的产品发挥了重要作用。其中，蔡司的桥式、悬臂和在线测量机以及三维的光学和接触式测量机，都可以用于工业CT的应用。特别地，蔡司的电脑断层扫描技术大大增强了工业CT的功能。

我们推荐使用蔡司的产品之一——ZEISS METROTOM 1。这是一款易于使用的工业CT设备，只需一次扫描，任何人都能有效完成复杂的测量和检查任务。它可以测量并检测接触式或光学测量系统无法检测到的隐藏缺陷和内部结构。此外，由于ZEISS METROTOM 1的体积小，它可以轻松放置于测量实验室中，一次性完成内部测量和检查。

ZEISS METROTOM 1具有许多优势，这也是为什么我们推荐它用于工业CT应用的原因：

操作简便：ZEISS METROTOM 1是以用户为基础建造的。安装过程简单，只需进行少量培训就能使用CT。只需轻轻一点，即可开始扫描流程！

测量：ZEISS METROTOM 1可以测量并评估完整的零件，确保准确的数模比对、尺寸检查和壁厚分析。

占地面积小：蔡司METROTOM

1非常紧凑，适合任何测量实验室。这使得您可以在公司内部进行测量和，而无需依赖外部测量服务。

总结而言，工业CT技术以及蔡司的METROTOM 1产品为实现全尺寸测量提供了可靠的解决方案。它不仅提高了产品检测效率，加速了新产品上市速度，同时也具备稳定性和可靠性。作为北京蔡司X射线断层扫描授权代理商，我们将为您提供符合您需求的产品和解决方案，助您取得更大的成功。

问答：问：工业CT对于产品的尺寸检测有何优势？

答：工业CT能够在对检测物体无损伤的条件下，以二维断层图像或三维立体图像的形式，清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况。相比传统的三坐标测量机，工业CT能够大大缩短编程时间，并将单件检测时间减少至10分钟。这极大地提高了产品的检测效率，加速了新产品的上市速度。

问：METROTOM 1的尺寸是否适合任何测量实验室？

答：是的，METROTOM 1非常紧凑，尺寸为1750 mm(长) x 1820 mm(高) x 870 mm(宽)，适合任何测量实验室。这使得您可以在公司内部进行测量和，而无需依赖外部测量服务。

基于蔡司工业CT-METROTOM

的工业计算机断层扫描（CT）利用蔡司的工业计算机断层扫描系统，仅需一次X射线扫描，即可顺利完成工件的测量和检验。标准的验收检测、精密工程和完善的校准程序可确保系统的追踪性。配备线性导轨及转台，满足客户对性的高要求。蔡司METROTOM系列一直为质量控制提供可靠的CT技术。第三代计算机断层扫描（CT）系统蔡司工业CT测量机METROTOM 1500工业CT三维断层扫描极好地证明了先进可靠的X射线技术不再是未来的愿景。您可以使用面向未来的质量控制。蔡司工业CT测量机METROTOM 1500工业CT三维断层扫描特性

- 1.看得更多在第三代系统中，新的3k检测器可生成更高分辨率的3D体数据集，即更多体素可以检测到更小的缺陷。
- 2.扫描更快通过检测器的不同操作模式，扫描时间可减少多达75%，同时获得与2k检测器相当的体素尺寸。
- 3.测量与检验整体部件蔡司METROTOM是一种工业计算机断层扫描系统，用于测量和检查由塑料或轻金属制成的完整部件。而在利用传统测量机测量时，此类隐藏性的结构信息只有将零件通过费时的层层破坏方能获得。
- 4.轻松且地进行多样化特征检测利用蔡司METROTOM 计算机断层扫描系统可一次扫描海量的零部件特征。这些测量结果非常，且具可追溯性。和接触式测量方法不同，蔡司METROTOM
- 5.直观简易的软件操作仅需通过短时间的蔡司METROTOM OS 软件培训课程，操作人员即可对零件进行扫描，透视零件的内部。通过蔡司CALYPSO和NEO软件，您可以评估CT数据，通过蔡司PiWeb，它们可以在一个测量报告中快速合并。